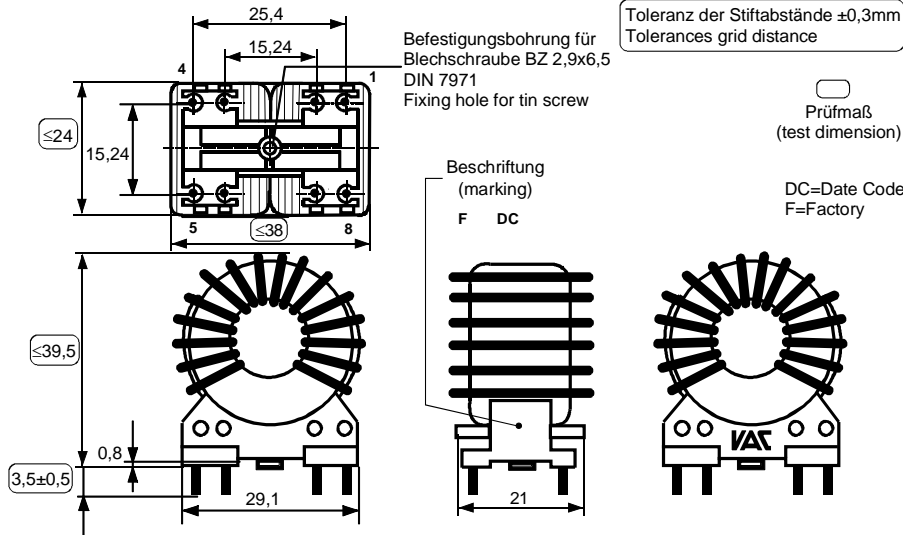


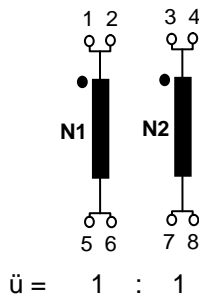
K-Nr.: 17599      Speicherdrossel / Storage choke      Datum: 15.10.2012  
 K-no.:      Date:

 Kunde: Typenelement / Standard type      Kd. Sach Nr.:      Seite 1 von 1  
 Customer      Customers part no.:      Page of

 Maßbild (mm): Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c  
 Mechanical outline      General Tolerances

 Anschlüsse:  
 Connections:  
  
 Cu-verzinkt  
 Cu-tinned  
 Ø 1,06 mm

 Beschriftung:  
 inscription

 X021  
 F DC

 Anschlussschema:  
 Schematic diagram

 Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte):  
 Operational data/characteristic data (nominal values):

 $I_N = 10,5 \text{ A}$      $L = 46,0 \mu\text{H}$  (N1 + N2 in Reihe/series)  
 $I_N = 21 \text{ A}$        $L = 11,5 \mu\text{H}$  (N1 + N2 parallel)  
 $\Delta I = 0,2 \cdot I_N$   
 $f \leq 200 \text{ kHz}$ ,  $\tau \geq 0,25$ 

 Umgebungstemperatur/ambient temperature: -40°C...+60°C  
 Lagertemperatur/storage temperature: -40°C...+85°C

 Prüfung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1; SC = significant characteristic)  
 Inspection

- |               |          |  |
|---------------|----------|--|
| 1) (V)        | M3014:   | $U_{p,eff} = 500 \text{ V}$ , 3 s, N1 gegen/vs N2 (Pin 1, 2, 5, 6 gegen/vs 3, 4, 7, 8)   |
| 2) (V)        | M3214:   | $L = 46 \mu\text{H} + 25\% -10\%$ , $I_{DC} = 10,5 \text{ A}$ , $f = 100 \text{ kHz}$ , $U_{AC,eff} = 250 \text{ mV}$ (SC)<br>(N1+N2 in Reihe/series)      alternative $f = 10 \text{ kHz}$ $I_{AC,eff} = 10 \text{ mA}$ |
| 3) (AQL 1/S4) | M3011/5: | $R_{Cu1} \leq 7,6 \text{ m}\Omega$ ; $R_{Cu2} \leq 7,6 \text{ m}\Omega$  |
| 4) (Fix 05)   | M3290:   | Lötbarkeitstest nach Abschnitt 1<br>solderability test acc. to chapter 1   |

 Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur  
 Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature

 Weitere Vorschriften:      Anschlußträger:      UL-gelistet  
 Applicable documents:      Terminal:      UL-listed

Datum	Name	Index	Änderung
15.10.12	Re	80	Mechanical outline updated (test dimensions) and SC-value specified. CN-539

Hrsg.: KB-E editor	Bearb: Lo. designer	KB-PM: RKI. check	freig.: HS released
-----------------------	------------------------	----------------------	------------------------

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9